

1. Record Nr.	UNINA9910437351203321
Titolo	2020 IEEE 38th VLSI Test Symposium (VTS) // Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), , 2020
ISBN	1-7281-5359-X
Descrizione fisica	1 online resource (various pagings) : illustrations
Disciplina	621
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia